

УДК 539.211

ЭЛЕКТРОННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ И ЛОКАЛЬНЫЕ УРОВНИ В МОНОКРИСТАЛЛАХ SbSI

Ю. В. Попик, В. В. Беца

Исследовано влияние состояния поверхности на свойства сульфиода сурьмы. Показана роль поверхностных явлений в образовании и процессах изменения заполнения локальных уровней в полупроводниках—сегнетоэлектриках.

Полупроводниковым свойствам SbSI посвящено много работ, результаты которых нашли обобщение в монографиях [1–3]. Наличие локальных уровней в запрещенной зоне определяет не только полупроводниковые, но также сегнетоэлектрические и фотосегнетоэлектрические свойства. Имеющиеся в литературе данные о параметрах локальных уровней в запрещенной зоне SbSI очень противоречивы. По данным, полученным из температурной зависимости тока проводимости, энергия активации дискретных донорных уровней находится в пределах 0.4 ± 0.8 эВ [4–7], акцепторных — 1.08 и 0.49 эВ в сегнето- и парафазовом состоянии соответственно [8]. А определенные по термостимулированной проводимости (ТСП) значения энергий этих уровней равны 0.1 ± 0.6 эВ [7], 0.4 эВ [9], 0.19 ± 0.64 эВ [10], 0.21, 0.41 и 0.43 эВ [11]. Нет однозначности и относительно типа проводимости в этих кристаллах.

Такое разнообразие количества и энергетического положения локальных уровней в SbSI нельзя объяснить различной степенью чистоты исследуемых образцов, ибо, как показали исследования методом термостимулированной деполяризации [12], легирование атомами Cu, Ga, In, Ge, Sn, Pb заметно влияло на температуру сегнетоэлектрического фазового перехода, но к появлению новых уровней не приводило — наблюдалось заметное изменение заполнения и незначительное смещение обнаруженных в исходном веществе двух уровней. С другой стороны, было замечено [13], что адсорбция кислорода на поверхности SbSI приводит к появлению нового локального уровня в запрещенной зоне. Ранее нами также было обнаружено, что адсорбция на поверхности монокристаллов $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{S}_6$ может существенно ($\sim 10^3$ раз) изменить заполнение локальных уровней [14]. Исходя из этого возникает вопрос, не является ли одной из причин в неопределенности параметров локальных уровней в монокристаллах SbSI электронное состояние поверхности? Поиску ответа на этот вопрос и посвящена данная работа.

Так как на кривых термостимулированной проводимости проявляются только довольно глубокие уровни, то в качестве метода определения энергетического положения уровней нами избрана температурная зависимость темновой проводимости σ . Для уменьшения роли поляризационных эффектов измерения σ проводились на переменном токе частотой 19 Гц при амплитуде тянувшего поля ≤ 10 В/см. Электронное состояние поверхности изменялось различной степенью очистки поверхности и адсорбцией молекул кислорода (акцептор), водорода (донор) и метилового спирта CH_3OH (чисто дипольное взаимодействие). Для исследований выбирались наиболее совершенные монокристаллические образцы из разных технологических

партий, полученные методом кристаллизации из паровой фазы. Из каждой партии отбирались два типа образцов: на начальном этапе критерием для разделения образцов служила величина естественной поляризации P_e , определяемая по пиротоку. К первому типу относили образцы, у которых без предварительной поляризации практически отсутствовал пироток ($P_e < 0.1 \text{ мКл/см}^2$), ко второму — образцы с $P_e \geq 1.0 \text{ мКл/см}^2$. Контакты из аквадага или индий-галиевого сплава наносились на торцы образцов, предварительно протравленные в 4–5 % растворе соляной кислоты, перпендикулярные полярной оси C [001]. Адсорбция и измерения термоэлектронной работы выхода методом выбирирующего конденсатора с золотым или платиновым отсчетными электродами проходили на гранях, параллельных оси C .

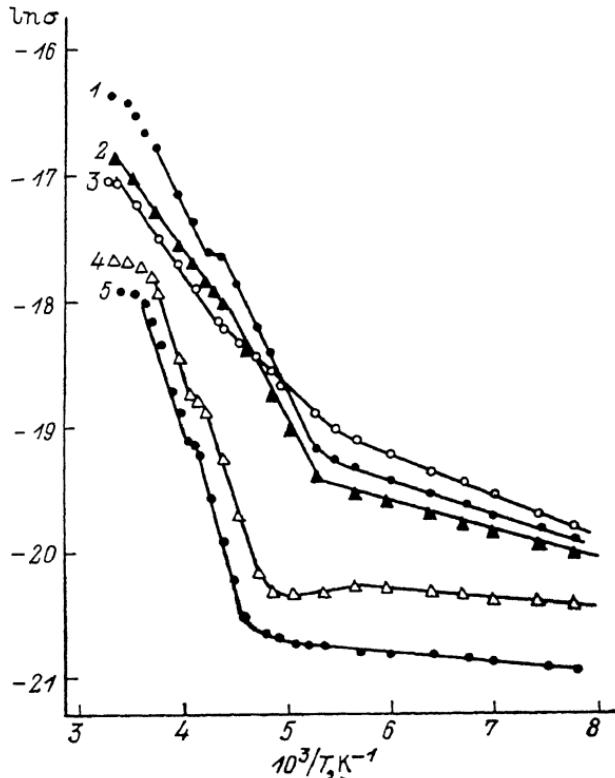


Рис. 1. Температурная зависимость темновой проводимости для одного из образцов SbSI второго типа.

1 — в вакууме $1.3 \cdot 10^{-3}$ Па; 2, 3 — в атмосфере водорода; 4, 5 — в атмосфере кислорода; $T_{\text{адс}}, \text{К}$: 2, 4 — 273; 3, 5 — 100. Давление адсорбатов равно 240 Па.

У первого типа кристаллов при понижении температуры от 290 до 100 К проводимость уменьшалась всего в 2–3 раза, а у второго — примерно в 10 раз. Для первого типа образцов характерными были тенденции к уменьшению проводимости при нагревании в области 250–280 К и отсутствие глубоких уровней прилипания в интервале энергий 0.4–0.9 эВ. Очистка поверхности в результате проведения начальных тренировочных циклов (прогрев в вакууме $\sim 6 \cdot 10^{-7}$ Па, полученном безмасляной откачкой, при 350 К в течение 30 минут — охлаждение до температуры жидкого азота — нагрев и измерение с при стабилизированной с точностью ± 0.01 К температуре) существенно влияла на величину проводимости и параметры локальных уровней.

Более богатый набор локальных уровней имели образцы второго типа. Поэтому основные исследования проведены на кристаллах этого типа. После проведения 3 тренировочных циклов последующее циклирование в высоком вакууме дает хорошо воспроизводимые результаты: отклонение измеряемых параметров не превышало 2–3 %.

Таблица 1

Энергии активации локальных уровней в образцах SbSI второго типа в вакууме $1.3 \cdot 10^{-3}$ Па и при адсорбции водорода и кислорода (по данным рис. 1) (давление адсорбатов 240 Па)

Окружающая среда	Интервал температур ΔT_1 , К	ΔE_1 , эВ	Интервал температур ΔT_2 , К	ΔE_2 , эВ	Интервал температур ΔT_3 , К	ΔE_3 , эВ
Вакуум, $P = 1.3 \cdot 10^{-3}$ Па	125—180	0.06	180—230	0.13	235—290	0.21
H_2 , $T_{адс} = 273$ К	125—185	0.05	185—230	0.31	240—260	0.31
H_2 , $T_{адс} = 100$ К	125—185	0.04	185—230	0.31	240—280	0.23
O_2 , $T_{адс} = 273$ К	125—180	0.01	210—240	0.60	250—280	0.46
O_2 , $T_{адс} = 100$ К	125—175	0.01	200—240	0.26	250—280	0.46

Сначала рассмотрим характер влияния адсорбции на реальной поверхности кристаллов. В этом случае поверхность образцов очищалась в вакууме $1.3 \cdot 10^{-3}$ Па при 340 К в течение 4 часов. Характерные результаты приведены для одного из исследованных образцов на рис. 1 и в табл. 1. Последовательность адсорбционных циклов в этой серии измерений была такова: вакуум—водород—вакуум—кислород—вакуум. Видно, что адсорбция даже на реальной поверхности существенно деформирует энергетический спектр локальных уровней.

Дальнейшие исследования адсорбции нами проведены на чистой поверхности. Поверхность очищалась в вакууме $6 \cdot 10^{-7}$ Па экспоронированием образцов в течение полутора часов при 300 К и последующим 30-минутным прогревом при 350 К. При этой температуре в масс-спектрах остаточных газов появляются осколки испарения монокристалла SbSI, а при 360 К обнаружены ионы SbI_3^+ , SbI_2^+ , SbI^+ , $Sb_2S_4^+$, $Sb_3S_4^+$, Sb_2^+ , I^+ и т. д. Это свидетельствует о том, что при 350 К происходит очистка поверхности образца от окислов и продуктов адсорбции и начинается испарение твердого сульфиода сурьмы, т. е. поверхность становится атомарно чистой. Характерные результаты этих исследований приведены в табл. 2. Для сравнения данные в этой таблице приведены для того же образца, что и в табл. 1.

Из всех исследованных нами адсорбатов адсорбция молекул метилового спирта оказывала наименьшее влияние на изменение величины проводимости — с уменьшалось примерно на 3—5 %, что указывает на преимущественно дипольный механизм адсорбции молекул CH_3OH .

Величина и знак изменения с и энергетического положения локальных уровней существенно зависит от температуры адсорбции водорода и кислорода. Отсюда можно предположить, что адсорбция этих молекул при 100 и 273 К проходит по различным механизмам. Частично ответ на этот вопрос дают исследования контактной разности потенциалов φ_k (КРП) или термоэлектронной работы выхода $e\varphi_t$. Результаты этих исследований

Таблица 2

Влияние адсорбции на чистой поверхности монокристаллического образца SbSI на энергию активации локальных уровней (давление адсорбатов 240 Па)

Окружающая среда	Интервал температур ΔT_1 , К	ΔE_1 , эВ	Интервал температур ΔT_2 , К	ΔE_2 , эВ	Интервал температур ΔT_3 , К	ΔE_3 , эВ
Вакуум, $P = 6 \cdot 10^{-7}$ Па	130—180	0.02	180—230	0.14	235—290	0.21
H_2 , $T_{адс} = 273$ К	140—205	0.13	205—230	0.33	235—290	0.43
H_2 , $T_{адс} = 100$ К	140—210	0.12	210—230	0.43	240—260	0.56
O_2 , $T_{адс} = 273$ К	150—170	0.01	200—220	0.43	235—290	0.72
O_2 , $T_{адс} = 100$ К	130—170	0.01	200—230	0.28	240—290	0.40
CH_3OH , $T_{адс} = 273$ К	—	—	200—235	0.40	240—290	0.52

представлены на рис. 2. Термоэлектронная работа выхода с очищенной поверхности образцов при 298 К составляет 4.76 эВ (на воздухе — 5.07 эВ). Если учесть, что для кристаллов SbSI фотоэлектронная работа выхода равна 5.8 ± 0.1 эВ ([³], с. 100) и ширина запрещенной зоны $E_g = 1.92$ эВ ([¹], табл. 4), то для положения уровня Ферми E_F относительно потолка валентной зоны получим 1.04 ± 0.10 эВ. Так как E_F расположен выше середины запрещенной зоны, то исследованные нами образцы имели *n*-тип проводимости. Согласно электронной теории хемосорбции [¹⁵], на *n*-тип проводимости указывают также результаты влияния адсорбции кислорода и водорода на проводимость и термоэлектронную работу выхода (рис. 2).

Довольно значительное изменение работы выхода сульфоидида сурьмы при адсорбции кислорода и водорода указывает на то, что локализация этих веществ приводит к заряжению поверхности, т. е. имеет место заряженная форма хемосорбции, которая обусловливает и изменение проводимости.

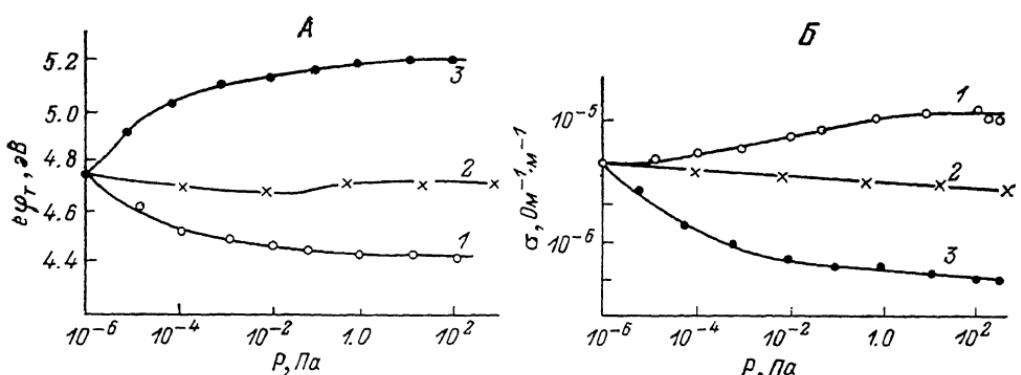


Рис. 2. Зависимость термоэлектронной работы выхода (*a*) и темновой проводимости (*b*) SbSI от давления адсорбата при 288 К.

1 — в атмосфере водорода, 2 — метилового спирта, 3 — кислорода.

Для выяснения возможности двух механизмов адсорбции водорода и кислорода нами проведены температурные исследования $e\varphi_t$ (рис. 3). Из анализа влияния адсорбции при разных температурах на проводимость и данных рис. 3 можно заключить: а) адсорбция водорода при температурах ниже 230 К вызывает уменьшение проводимости и увеличение $e\varphi_t$, что для образцов *n*-типа проводимости указывает на «акцепторный» механизм адсорбции; б) в области выше 240 К адсорбция водорода уменьшает $e\varphi_t$ и увеличивает σ — «донарный» механизм. В [¹⁶] теоретически показано, что в случае металлов и некоторых полупроводников водород может адсорбироваться в двух формах: H_2^δ (*r*-форма) и H^+ (*s*-форма). При *r*-форме величина отрицательного заряда на адсорбированной молекуле $\delta \sim 0.02$ элементарного заряда, поэтому эта форма адсорбции водорода увеличивает $e\varphi_t$ и уменьшает σ образцов *n*-типа проводимости. Правдоподобно, что *r*-форма адсорбции водорода имеет место на поверхности SbSI при температурах ниже 230 К, а в области выше 240 К преобладает *s*-форма. Аналогично можно сделать вывод, что и кислород тоже адсорбируется в двух формах O_2^δ и O^- .

Очень слабое влияние адсорбции метилового спирта на $e\varphi_t$ и σ объясняется тем, что дипольные моменты адсорбированных молекул ориентированы антипараллельно направлению вектора спонтанной поляризации. Такая геометрия адсорбции не должна влиять на $e\varphi_t$, ибо в этом случае не образуется двойной зарядовый слой.

Из выше изложенного напрашивается два вопроса. 1) Почему адсорбция дипольных молекул CH_3OH , практически не изменяя величин σ и $e\varphi_t$, существенно влияет на энергию активации проводимости? 2) Обязательно ли уровни активации σ , проявляющиеся при адсорбции того или

иного вещества, имеют адсорбционную природу? Без учета сегнетоэлектрических свойств SbSI ответить на поставленные вопросы невозможно. В настоящей работе проведены исследования в основном на образцах второго типа, обладающих сравнительно высокой естественной униполярностью, причиной которой является их повышенная дефектность по сравнению с образцами первого типа. Для простоты в дальнейшем при интерпретации будем исходить из монодоменного состояния, в случае же полидоменного состояния можно ожидать, что аналогичные процессы будут происходить в каждом домене.

Для существования монодоменного состояния необходимо экранирование спонтанной индукции, которое приводит к изгибу зон у торцов домена (в нашем случае — в приконтактных областях): у положительного торца — изгиб зон вниз, у отрицательного — вверх. Изменяя условия экранирования, адсорбция существенно влияет на величину остаточной естественной поляризации образцов [17, 18]: адсорбция водорода и мети-

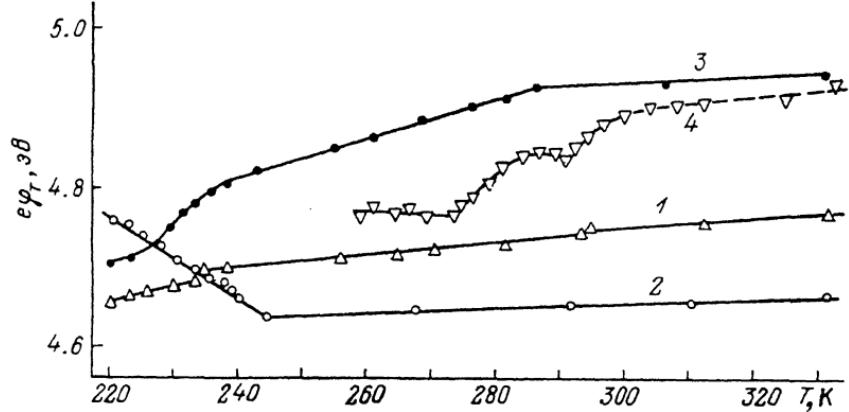


Рис. 3. Температурная зависимость термоэлектронной работы выхода SbSI.

1 — в вакууме $1.3 \cdot 10^{-6}$ Па; 2 — в атмосфере водорода, $P=0.5$ Па; 3 — кислорода, $P=1.3 \cdot 10^{-2}$ Па;
4 — метилового спирта, $P=1.3$ Па.

лового спирта увеличивает поляризацию, а кислорода — уменьшает. В нашем случае адсорбция водорода приводит к росту концентрации основных носителей заряда в объеме, что должно вызвать значительное уменьшение изгиба зон вниз у положительного торца домена. Увеличение концентрации носителей заряда, изменяя положение уровня химпотенциала в объеме, меняет заполнение и соответственно проявление на температурной зависимости σ тех или иных объемных локальных уровней, а процесс, связанный с экранированием спонтанной поляризации, влияя на изменение изгибов зон в ОПЗ у торцов домена (у контактов), — роль приповерхностных локальных уровней, расположенных в этой области. Адсорбция дипольных молекул, экранируя часть спонтанной поляризации у свободной поверхности кристалла, тем самым уменьшает изгиб зон в приконтактной области и соответственно меняет роль локальных уровней, расположенных в ОПЗ у торцов домена, в изменении σ . Роль кислорода проявляется через увеличение (у положительного торца домена) или уменьшение (у отрицательного) изгибов зон и понижение уровня химпотенциала в объеме. Наряду с этим адсорбированные молекулы могут образовать новые поверхностные состояния или изменить энергетическое положение и сечения захвата поверхностных состояний биографического происхождения. Разделить вклад каждого из механизмов влияния адсорбции на проявление того или иного локального уровня на температурной зависимости σ очень сложно. При проведении дополнительных исследований эту задачу частично можно решить.

Обобщая результаты данных табл. 1 и 2, обнаруженные нами локальные уровни можем сгруппировать: $E_1 = 0.01 \pm 0.06$ эВ; $E_2 = 0.12 \pm 0.03$ эВ; $E_3 = 0.21 \pm 0.02$ эВ; $E_4 = 0.31 \pm 0.03$ эВ; $E_5 = 0.43 \pm 0.03$ эВ; $E_6 = 0.56 \pm$

± 0.04 эВ; $E_7 = 0.72 \pm 0.05$ эВ. В парафазе при $T > 300$ К нами определены по проводимости уровни $E'_1 = 0.76 \pm 0.05$ эВ (в вакууме) и $E_8 = 1.6 \pm 0.1$ эВ (в кислороде). При $T < 170$ К в SbSI появляются две узкие люминесцентные полосы, максимумы которых соответствуют энергиям квантов $E_9 \sim 1.3$ и $E_{10} \sim 1.6$ эВ. Адсорбция кислорода приводила практически к полному тушению люминесценции и существенному уменьшению фотопроводимости. Заметим, что $E_8 \approx E_{10}$, $E_{10} + E_4 \approx E_9$, $E_9 + E_6 \approx E_7$. Это значит, что люминесценция в вакууме обусловлена рекомбинацией электронов, захваченных на уровнях E_4 и E_6 , с дырками в валентной зоне. Адсорбция кислорода, изменяя сечения захвата этих уровней, превращает их в уровни прилипания, проявляющиеся в $\sigma(T)$, но не принимающие участия в рекомбинации. Отсюда следует, что состояния, которым соответствуют энергетические уровни E_4 и E_6 , имеют биографическую природу и расположены в приповерхностной области граней, параллельных оси C . Состояния с локальными уровнями E_1 , E_2 , E_3 и E_7 (E'_1), проявляющиеся на $\sigma(T)$ при чистой поверхности образцов, также имеют биографическое происхождение, но их пространственное распределение нам неизвестно. Состояния с локальным уровнем E_5 , не проявляющиеся в вакууме, но наблюдаемые при адсорбции O_2 , H_2 и CH_3OH , правдоподобно расположены в ОПЗ у торцов доменов (в приконтактных ОПЗ) и имеют биографическую природу. Если бы эти состояния были расположены в приповерхностных ОПЗ граней, параллельных оси C , то адсорбция молекул различных веществ по-разному влияла бы на параметры этих состояний.

Полученные нами результаты дают возможность сделать следующие выводы.

1) Имеющиеся в литературе противоречивые данные относительно количества и энергетического положения локальных состояний в запрещенной зоне SbSI обусловлены не столько разной технологией, сколько различным состоянием поверхности исследованных образцов.

2) Очисткой образцов в сверхвысоком вакууме и адсорбцией кислорода, водорода и метилового спирта при различных температурах можно получить весь энергетический спектр локальных уровней, обнаруженных по частям разными авторами. Специфика сегнетоэлектриков состоит в том, что адсорбция изменяет параметры состояний (сечения захвата, энергетическое положение, заполнение) не только расположенных вблизи адсорбирующей поверхности, но также объемных локальных состояний и состояний в приконтактных ОПЗ.

3) В ряде случаев сочетание физических методов измерений и адсорбционного метода управления электронным состоянием поверхности дает возможность определить пространственное распределение локальных электронных состояний.

4) Изложенные выше результаты по влиянию состояния поверхности на параметры локальных уровней характерны для всех сегнетоэлектриков — полупроводников.

Л и т е р а т у р а

- [1] Фридкин В. М. Сегнетоэлектрики — полупроводники. М.: Наука, 1976. 408 с.
- [2] Фридкин В. М. Фотосегнетоэлектрики. М.: Наука, 1979. 264 с.
- [3] Герзанич Е. И., Фридкин В. М. Сегнетоэлектрики типа AV_3O_7 . М.: Наука, 1982. 228 с.
- [4] Пикко Т. А. Кристаллография, 1967, т. 2, № 4, с. 1075—1076.
- [5] Носов В. Н., Фридкин В. М. ФТТ, 1966, т. 8, № 1, с. 148—149.
- [6] Григас Б. П. ФТП, 1968, т. 2, № 4, с. 481—487.
- [7] Sasaki J. Japan J. Appl. Phys., 1964, vol. 3, N 9, p. 558—559.
- [8] Toyoda K., Ishikawa J. J. Phys. Soc. Japan, 1970, vol. 28, Suppl., p. 5451—5454.
- [9] Алексеева В. Г., Ландсберг Е. Г. ФТТ, 1966, т. 8, № 10, с. 3138—3140.
- [10] Баринов Л. П. В сб.: Полупроводники — сегнетоэлектрики. Ростов-на-Дону: РГУ, 1973, с. 110—112.
- [11] Семак Д. Г., Туряница И. Д., Кикинешви А. А. Изв. АН СССР, сер. Неорг. материалы, 1975, т. 11, № 6, с. 1140—1141.
- [12] Туряница И. Д., Коперльос Б. М., Семак Д. Г., Михалько И. П., Кикинешви А. А. УФЖ, 1973, т. 18, № 11, с. 1912—1914.

- [13] Копинец И. Ф., Рубиш И. Д., Микуланинец С. В. УФЖ, 1971, т. 16, № 10, с. 1724—1725.
- [14] Попик Ю. В., Сейковский И. Д. Сложные полупроводники (получение, свойства, применение). Ужгород: Радянське Закарпаття, 1981, с. 35—39.
- [15] Волькенштейн Ф. Ф. Физико-химия поверхности полупроводников. М.: Наука, 1973. 399 с.
- [16] Поверхностные свойства твердых тел. Сб. ст. под ред. М. Грина. М.: Мир, 1972. 432 с.
- [17] Беца В. В., Попик Ю. В., Туряница И. Д. Сб. Электронные процессы на поверхности полупроводников и на границе раздела полупроводник—диэлектрик. Новосибирск, 1974, с. 276—279.
- [18] Попик Ю. В., Жихарев В. Н., Беца В. В. ФТТ, 1982, т. 24, № 2, с. 486—493.

Ужгородский
государственный университет
Ужгород

Поступило в Редакцию
6 октября 1987 г.